

【原因・判断ポイント・発生工程】ネガタイプ A W F の不透明部に付いた傷部が露光して出来たもの (A W F 作製後～ E T 工程)

【原因、判断要点、发生工序】对 AWF 不透明区有伤痕部位曝光时所引起的 (AWF 制作后 ~ ET 工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Exposure is made with a phototool with a scratch on the opaque area of the negative pattern causing the defect. (Preparation of phototool - etching process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

### 1-8-3-6 纖維状異物介在露光被り短絡 / 纤维杂物妨碍曝光的短路 / Short by photographic fogging by an adhered fibrous object

【特徴】複数の回路線にまたがって、比較的長く短絡している状態の欠陥、めっき面の凹凸は認められない

【特征】跨过多条线路比较长的短路缺陷，而不是镀层面的凹凸。

【Characteristics】A short of a relatively long distance extending several conductors. Unevenness of the plated surface is not observed.

【原因・判断ポイント・発生工程】D F R と A W F 間に介在した纖維状異物により、A W F が浮き上がり状態となり、露光被りして出来たもの (露光工程 ~ E T 工程)

【原因、判断要点、发生工序】DFR 和 AWF 之间夹杂纤维杂物，AWF 鼓起而妨碍曝光所引起的 (曝光工序 ~ ET 工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Photographic fogging caused by lift of a phototool by a fibrous foreign object between dry film and a phototool generates the defect. (Exposure - etching process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】  
显微镜倍率 × 50

【Comments】  
Magnification: ×50



【コメント】  
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】  
显微镜倍率 × 50

【Comments】  
Magnification: ×50